**Раздел "Перечень имеющихся методик/методов выполнения измерений"**

Выявление особенностей физического и химического внешних воздействий на материалы методом профилометрии.

Метод зонда Кельвина

Метод контактной и полуконтактной атомно-силовой микроскопии

Метод контактной спектроскопии для определения модуля Юнга

Метод магнитно-силовой микроскопии

Метод полярного эффекта Керра

Метод разделения в адсорбционных ситах воздуха и последующее сжижение азота посредством цикла Гиффорда-Макмагана

Метод резистивного нагрева

Метод темного поля, Метод светлого поля

Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ЦВ 3.19.08-2008

Методика выполнения измерений содержания элементов в твердых объектах методами спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ЦВ 5.18.19.01-2005

Методика выращивания крупногабаритных монокристаллов из расплава парателлурита

Методика измерения отклонений поверхностей от кристаллографических плоскостей в монокристаллах германия и парателлурита

Методика определения параметров шероховатости оптических поверхностей

Методика получения 2-D и 3-D профилей поверхностей исследуемых материалов

Микроскопия пьезоотклика

Определение параметров микро-, наноструктуры металлов и сплавов, материалов электронной техники, функциональных и композитных материалов, порошков, плёнок, строительных материалов, минералов, полимеров, керамики, биологических объектов

Определение параметров шероховатостей шлифованной и полированной поверхностей

Определение химического состава образцов с помощью анализатора Oxford Instruments INCA

Полуконтактная атомно-силовая микроскопия

Программный комплекс GAMES

Программный комплекс GAUSSIAN 03

Разработка методов и устройств неразрушающего контроля материалов электронной техники

Силовая литография

Сканирующая туннельная микроскопия